# XRR 解析レポート

### プロジェクト

パス: 未保存

DBでの共有レベル: 共有

#### 解析条件

波長(nm): 0.15403 点数: 1451

ステップ = 0.004 オフセット=0.000e+000

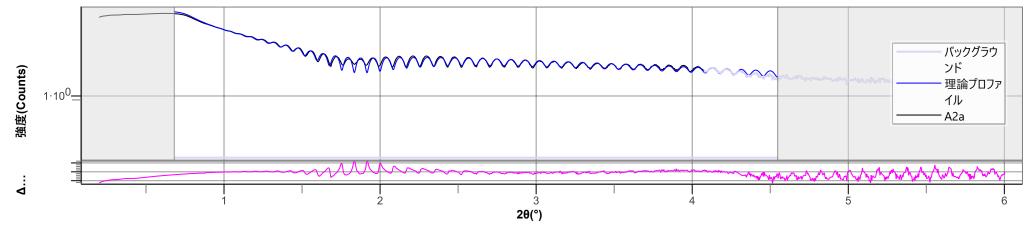
フィッティング手法: 準ニュートン データ間隔:1点ごとにフィッティング 2θ(°):開始 = 0.200,終了 = 6.000 残差タイプ: |Δ(LogI)|

最大反復数: 500 許容誤差: 1.00e-010

装置関数: 擬Voigt関数 ローレンツ関数の比率: 0.00 ローレンツ幅: 1.00e-002 ガウス幅: 1.00e-002

## 結果

## プロファイルプロット



使用	層番号 ▼	材料	膜厚(nm)			密度(g/cm³) <d></d>			粗さ(nm) <rgh></rgh>	
<b>✓</b>	L4	Fe2O3		1.396	Const		1.00001	Const	0.138	Con
			±0.02		精密化	±0.03	最小←	精密化	±0.02	精密化
$\checkmark$	L3	Fe2O3		2.511	Const		4.95000	Const	0.200	Con
			±0.6		精密化	±0.06	→最	大 精密化	±0.013	精密化
$\checkmark$	L2	* * o Fe		92.240	Const		7.87293	Const	0.466	Con
	LZ		±0.04		精密化	±0.02		精密化	±0.008	精密化
<b>✓</b>	L1	Fe Fe		0.961	Const		4.62137	Const	0.272	Con
	LI		±0.05		精密化	±0.03		精密化	±0.012	精密化
	基板	Si		00			2.32924	Const	0.500	Con